

СОДЕРЖАНИЕ

Том 44, номер 4, 2015

КВАНТОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Моделирование спектроскопического отклика фотонных изомеров с NV-центрами. Часть I

А. В. Цуканов 243

Изучение влияния амплитудной и фазовой релаксации на качество квантовых информационных технологий

*Ю. И. Богданов, Б. И. Бантыш, А. Ю. Чернявский,
В. Ф. Лукичев, А. А. Орликовский* 257

ПРИБОРЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Анализ характеристик субмикронных МДП-транзисторов с периодическим легированием канала для предельных температурных режимов работы

А. А. Краснюк, О. М. Орлов, Э. Ф. Имаметдинов, Е. В. Марына 263

Расчет теплораспределяющего элемента конструкции для мощных СВЧ-транзисторов

И. А. Глинский, Н. В. Зенченко 269

Многопиксельный линейный детектор рентгеновского излучения на основе монокристаллов CdZnTe

*В. Ф. Дворянкин, Г. Г. Дворянкина, Ю. М. Дикаев,
А. А. Кудряшов, А. Г. Петров, А. А. Телегин* 275

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Физические свойства контактов с барьером Шоттки на основе силицид иридия—кремний

Э. А. Керимов 278

Формирование межэлементной металлизации GaAs монокристаллов интегральных схем на основе меди

С. В. Ишуткин, В. А. Кагадей, Е. В. Ерофеев, Е. В. Анищенко 282

СХЕМОТЕХНИКА

Помехоустойчивость двухфазной КМОП 28 нм комбинационной логики к переходным эффектам воздействия одиночных ядерных частиц

Ю. В. Катунин, В. Я. Стенин 290

Помехоустойчивое кодирование на двухфазных 28 нм КМОП-логических элементах

Ю. В. Катунин, К. Э. Левин 299

МЕТРОЛОГИЯ

Виртуальный растровый электронный микроскоп. 5. Применение в нанотехнологии и в микро- и нанoeлектронике

Ю. А. Новиков 306
